

Extending the Limits of Your Exploration.

ZEISS Xradia Versa



ZEISS Workshop - La Microscopia a Raggi X nelle Scienze dei Materiali **ZEISS on your Campus Program**

Il workshop offre una panoramica sulla caratterizzazione non distruttiva 3D, ad alta risoluzione dei materiali mediante l'utilizzo della microscopia a Raggi X.

Durante il corso saranno esposti i punti di forza e le sfide della tomografia ad alta risoluzione; verranno analizzate le diverse tecnologie disponibili, come il Contrasto per Diffrazione o il Contrasto di Fase, verrà evidenziato come queste tecnologie possano essere combinate con esperimenti in situ e con la microscopia correlativa elettronica e ottica.

La seconda parte del workshop sarà focalizzata sulle applicazioni di questa tecnica: lo studio della dinamica dei fluidi nelle rocce e nei mezzi porosi, l'evoluzione della microstruttura in metallurgia mediante l'uso della LabDCT, la reologia di materiali compositi polimerici e l'analisi di campioni biologici tipicamente problematici dal punto di vista dell'assorbimento dei raggi X..

VENERDI' 20 SETTEMBRE 2019

DURATA: dalle ore 11.00 alle ore 12.30

LOCATION: Università di Pisa - Dipartimento di Scienze della Terra Via S. Maria,53 – Aula C

RELATORE: Nicolas Gueninchault, Product Application and Sales Specialist XRM, Carl Zeiss Microscopy

Info: ZEISS MarCom marketing.czi@zeiss.com , tel. 02 93773249

